### Příspěvky týmu VUT v mezinárodních impaktovaných časopisech v roce 2018 **s dedikací na projekt** **AMISPEC (TE01020233)**

### (supp\_mat\_liter\_vut\_dedikace\_2018.doc)

1. L. Břínek, M. Kvapil, T. Šamořil, M. Hrtoň, R. Kalousek, V. Křápek, J. Spousta, P. Dub, P. Varga, T. Šikola: *Plasmon Resonances of Mid-IR Antennas on Absorbing Substrate: Optimization of Localized Plasmon-Enhanced Absorption upon Strong Coupling Effect*,ACS PHOTONICS 5 (2018), IF: 6,88, **(DEDIKACE PROJEKTU AMISPEC)**

Článek obsahuje výsledky PB4 z oblasti 3: Vytvoření technologického know-how a portfolia aplikací pro vyvinuté zařízení EBL (Vypracování a osvojení metod přípravy nanostruktur pomocí elektronové litografie - etapa II), časopis ACS PHOTONICS má Impact Factor 6,88 a v následujících oborech se nachází v 1. quartilech (Q1):

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY: 35/285,**Q1**, NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY: 19/92, **Q1**, OPTICS:7/94, **Q1**, PHYSICS, APPLIED: 16/146, **Q1**, PHYSICS, CONDENSED MATTER:13/67, **Q1**

1. M. Konečný, M. Bartošík, J. Mach, V. Švarc, D. Nezval, J. Piastek, P. Procházka, A. Cahlík, T. Šikola: *Kelvin Probe Force Microscopy and Calculation of Charge Transport in a Graphene/Silicon Dioxide System at Different Relative Humidity,* ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 10 (2018), **(DEDIKACE PROJEKTU AMISPEC)**

Článek obsahuje výsledky PB4 z oblasti 1: Vytvoření technologického know-how a portfolia aplikací pro vyvinuté zařízení UHV SEM/SPM (Vypracování a osvojení metod přípravy nanostruktur vhodných pro UHV SEM/SPM - etapa II), časopis ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES má Impact Factor 8,09 a v následujících oborech se nachází v 1. quartilech (Q1):

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY: 26/285, **Q1,** NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY: 15/ 92, **Q1**

1. R. Holeňák, T. Spusta, M. Potoček, D. Salamon, T. Šikola, P. Bábor: *3D localization of spinel (MgAl2O4) and sodium contamination in alumina by TOF-SIMS,* Materials Characterization, (2018), DOI https://doi.org/10.1016/j.matchar.2018.12.019. **(DEDIKACE PROJEKTU AMISPEC)**

Článek obsahuje výsledky PB4 z oblasti 2: Vytvoření technologického know-how a portfolia aplikací pro fokusovaný iontový svazek (FIB), časopis Vacuum má Impact Factor 2,892 a v následujícím oboru se nachází v 1. quartilu (Q1):

MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING: 3/75 (**Q1**)

1. Ondřej Šik, Petr Bábor, Josef Polčák, Eduard Belas, Pavel Moravec, Lubomír Grmela, Jan Staněk: *Low Energy Ion Scattering as a depth profiling tool for thin layers - Case of bromine, Methanol etched CdTe,* Vacuum 7857, (2018), DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.03.014. **(DEDIKACE PROJEKTU AMISPEC)**

Článek obsahuje výsledky PB4 z oblasti 2: Vytvoření technologického know-how a portfolia aplikací pro fokusovaný iontový svazek (FIB), časopis Vacuum má Impact Factor 2,067 a v následujících oborech se nachází v 2. quartilu (Q2):

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY: 140 of 285, (**Q2**) PHYSICS, APPLIED: 61 of 146, (**Q2**)